

## Anhang E: Bildnachweis

Abbildung 3: linkes Bild: rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Platin-Iridium Abtastspitze für den Tieftemperaturmeßplatz im IFW (N. Matz)  
rechtes Bild; rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer DME RasterScope 3000 Abtastspitze, gewonnen am Danish Institut for Fundamental Metrology (DFM)

Abbildungen 12, 15, 16, 25, 30, 31, 45: Rohdaten: N. Matz; HOPG (highly orientated pyrolytic graphite) Messungen mit dem Tieftemperaturrastertunnelmikroskop (TT-RTM) am IFW

Abbildungen 22, 48, 49 rechts: Rohdaten: L.L. Madsen DFM; Didodecylbenzen ( $\text{H}_{25}\text{C}_{12}(\text{C}_6\text{H}_4)\text{C}_{12}\text{H}_{25}$ )

Abbildung 32, 38, 39, 46, 47, 49, C.2, C.3: Rohdaten: N. Matz; Potentiometriemessung mit dem TT-RTM

Abbildung 36: bilineares Interpolationsschema; [Jaro90] Abb. 7.19

Abbildung 42: Rohdaten: N. Matz; Spektroskopiemessung mit dem TT-RTM

Abbildung 44: Rohdaten: N. Matz; goldbedampfte Kohlenstoffschicht, TT-RTM-Messung

Abbildung C.1: Tube-Scanner; DFM

Sämtliche Abbildungen von Messdaten wurden mit dem Programm XRTMA aus den genannten Quellen erzeugt.

**Erklärung:**

Hiermit erkläre ich, daß ich vorliegende Arbeit selbstständig, nur unter Benutzung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.

Dresden, den 6. Dezember 1995

Nils Schmeißer